

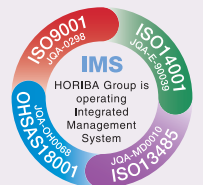
RoHS, 无卤, ELV应用领域的 最新仪器



MESA-50



X射线荧光分析仪



Touch and

多年以来，HORIBA销售的EDXRF分析仪和XGT-WR系列为客户提供RoHS，ELV和无卤检测，对含有害元素如Pb，Cd，Hg，Br等的样品进行筛选式测量，如今在世界范围内已广泛使用。

基于大量客户的要求，HORIBA凭借长期的经验开发出全新的EDXRF分析装置MESA-50。它将为您提供友好的操作界面和优异的使用性能。MESA-50具有三种尺寸的准直器可用于各种大小的样品，从细长的电线、微小的电子器件到大型的样品。

结合SDD检测器和HORIBA首创的DPP处理器，MESA-50将为您带来EDXRF的全新体验。MESA-50是HORIBA全新的生态采购支持仪器，不仅适合于欧洲的RoHS，ELV，也适用于其他地区的各种法规。



4S技术

1. 快速 Speedy

- 硅漂移检测器大幅度减少了测量时间，在高通量的同时提供了更高的灵敏度

2. 小巧 Small

- 便携式，体积小，重量轻
尺寸 294(长)×208(宽)×205(高)毫米，重量12千克
内置电池可持续测量6小时
- 无需担心X射线泄漏

3. 简单 Simple

- 减少日常维护工作（无需液氮）
- 无需真空泵
- 各种材料测量直观简单

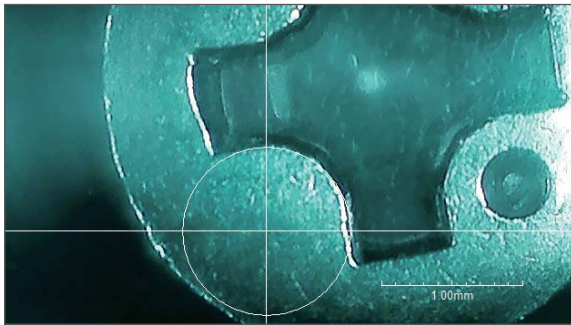
4. 智能 Smart

- 中英文操作软件
- Excel数据管理工具

简单的操作步骤

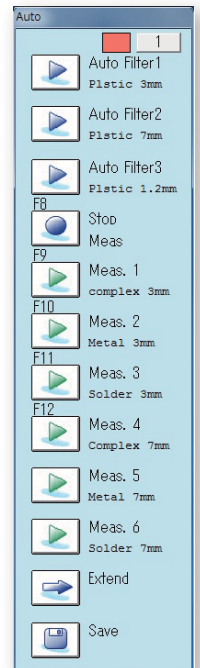
1. 放置样品

清晰的 CCD 图像使操作者放置样品更方便。X 射线光束和 CCD 相机同轴可以保证观察点即为测量点。



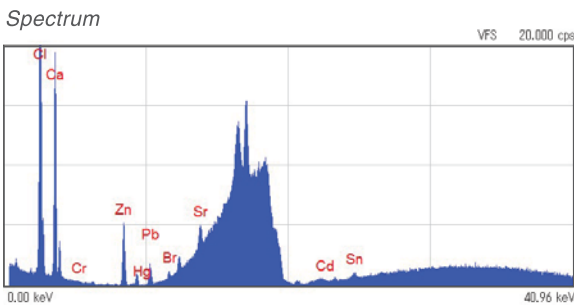
2. 点击测量按钮

各种材料的最佳测试条件可分配到各个测量按钮中（最多可设置18个按钮），从而仅需点击一个按钮即可测量不同的材料。操作者无需每次设定条件或切换滤光片，从而减少操作误差。可根据初始设置自定义创建操作按钮。



3. 谱图和计算结果的显示

测量结束后自动显示定量结果（包括浓度和 3σ ）



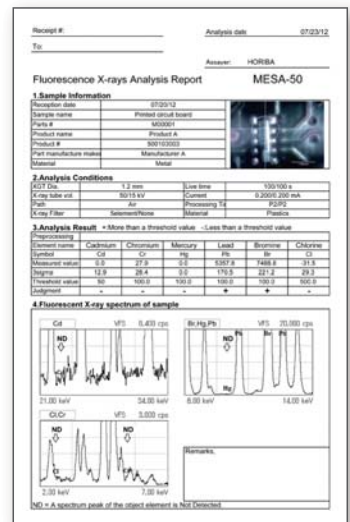
Quant. result of harmful element

No.	Target	Results	Unit	3sigma	Intensity(ppm/ks)
1	Pb	154.4798	ppm	4.2052	-
2	Ca	4.3078	ppm	3.5454	-
4	Cl	21.1408	ppm	74.0832	-
5	Hg	0.0000	ppm	4.5921	-
6	Br	19.7212	ppm	4.0835	-

Result

4. Excel数据管理软件和报告模板

测量结束后点击一个按钮即可将数据自动导入Excel[®]。如果设置企业内部管理值，可对结果的好坏进行自动判断（结果与阈值对比）。测量报告同样可以一键生成。



Seq	Parts #	Part Name	Operator	Date	Part	Cd [ppm]	3sigma	Judge	Pb [ppm]	3sigma	Judge	Cr [ppm]	3sigma	Judge	
5	1	CA0001	Cable1	HORIBA	07/20/12	Center	13.9	17.7	OK	125.2	18.1	Failed	53.6	46.7	Detect
6	2	CA0002	Cable2	HORIBA	07/20/12	Center	0.0	8.0	OK	112.5	5.6	Failed	0.0	14.3	ND
7	3	CA0003	Cable3	HORIBA	07/20/12	Center	3.0	3.3	OK	132.5	4.1	Failed	4.6	7.7	ND
8	4	CA0004	Cable4	HORIBA	07/20/12	Center	1.9	2.0	ND	125.1	5.8	Detect	0.0	16.7	ND

便携式！ 电池模式



小巧！

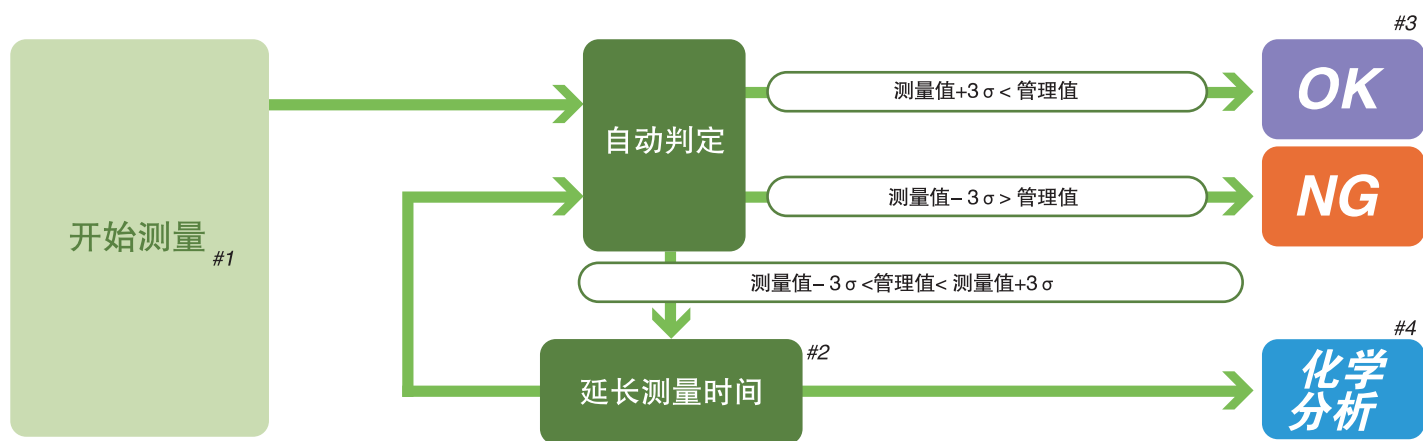
294(长)x208(宽)x205(高)

MESA-50的内置电池可持续工作6个小时



可选附件：便携包

自动延长测量时间



仪器可根据有害元素的管理值和测量值自动设置最佳的测量时间，最短可在 30 秒内同时测量 Cd/Pb/Cr/Hg/Br 五个有害元素。

#1 判定时间与有害元素的浓度和样品的材料有关

#2 可设置延长时间或重复次数(1~9次)

#3 测量结束后会自动判定OK或NG

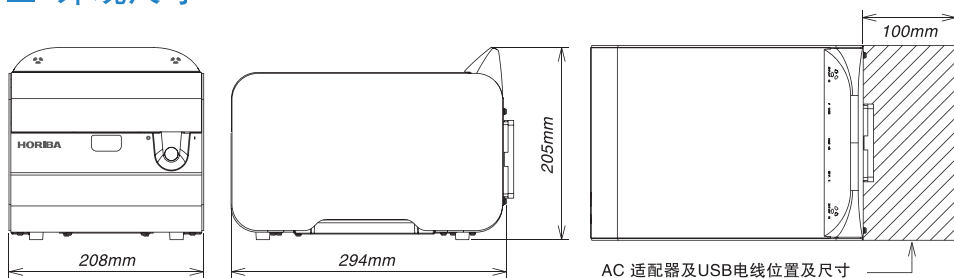
#4 如果测量时间延长最大后#2仍无法判定OK或NG，推荐使用化学分析方法如ICP进行测量

MESA-50规格

基本规格	原理	能量色散型X射线荧光光谱
	应用领域	RoHS, ELV, 无卤
	测量元素	13Al - 92U
	样品类型	固体, 液体, 粉末
X射线发生装置	X射线管	50kV (最高), 0.2mA
	X射线照射直径	1.2mm, 3mm, 7mm (自动切换)
	X射线一次滤光片	4种 (自动切换)
检测器	类型	SDD (硅漂移检测器)
	信号处理器	数字脉冲处理器
样品室	环境	大气
	样品观察	CCD镜头
设备	操作系统	电脑/笔记本 (Windows®7)
	供电	AC适配器 (100-240V, 50/60Hz)
		电池

* Windows7 is registered trademarks of Microsoft Corporation(USA)

外观尺寸



安装实例



可选配件及消耗品



便携包



电线固定架



一次性样品池



X射线透射膜

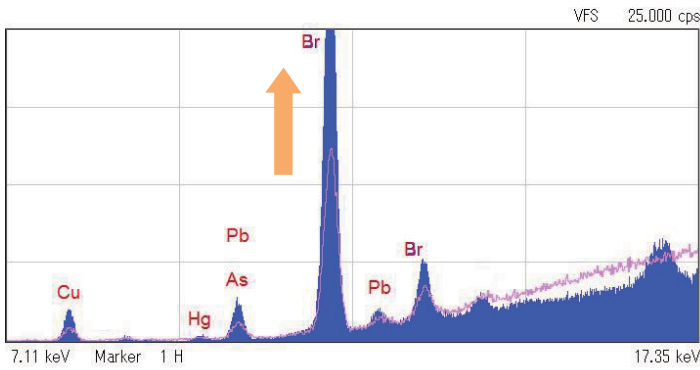


样品池膜

Feel! 首次发布 MESA-50

Hg Cr Cd Pb Br Cl

MESA-50 光学设计



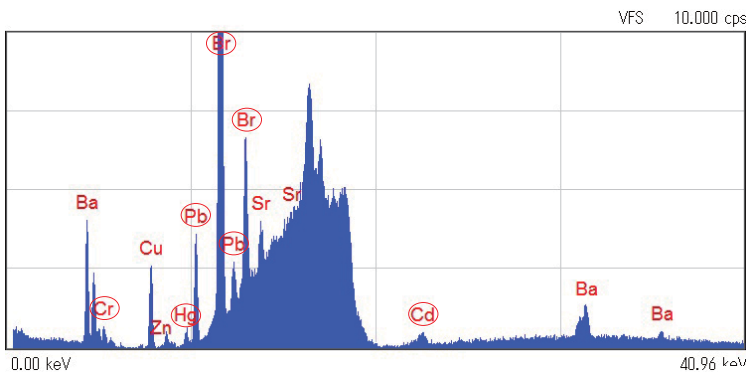
蓝:MESA-50 (φ 1.2mm), 红:XGT-1000WR (φ 1.2mm)

MESA-50的SDD检测器可以

- 1) 提高谱图强度和精度
- 2) 减少背景干扰

MESA-50紧凑的光学设计使其成为便携式的仪器，而小巧的低功耗X射线发生器仅需电池即可驱动。

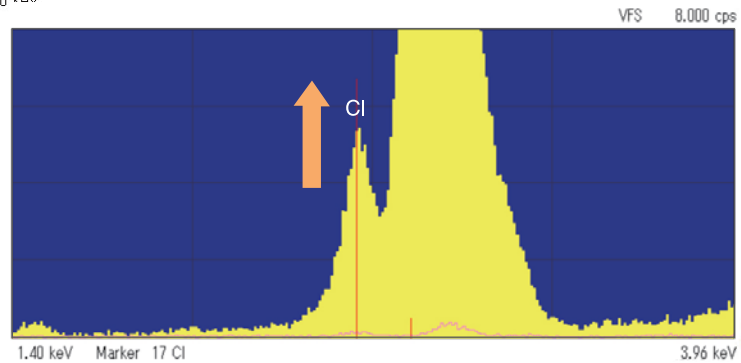
特殊滤光片，更好的性能



蓝:MESA-50 (φ 1.2mm)

MESA-50中安装有四种滤光片，其中一个独特的滤光片可同时检测Pb/Cd/Hg/Cr/Br五种有害元素。

MESA-50采用了最佳的X射线管靶材检测Cl元素，因此Cl的检测无需真空泵。



黄:MESA-50 (φ 3mm), 红: XGT-1700WR (φ 3mm)

3种尺寸准直器

Φ 1.2mm, 3mm, 7mm(自动切换)

操作者可根据样品大小选择合适的准直器，准确的测量区域会在光学图像中显示。如选用 1.2mm 的准直器即可直接测量单独一根电线，而无需将多根电线排布以覆盖 X 射线光束尺寸。

